XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451 2θ(°):開始 = 0.200,終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)|

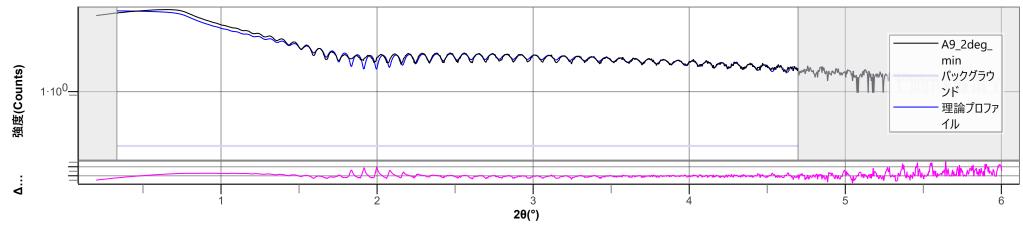
ステップ = 0.004 オフセット=0.000e+000 フィッティング手法: 準ニュートン データ間隔:1点ごとにフィッティング

最大反復数: 500 許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)			密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>		
	✓	L4	Fe2O3		0.613	Const		2.47500	Const	0.538	Con
				±0.04		精密化	±0.05	最小←	精密化	±0.012	精密化
	✓	L3	Fe2O3		2.297	Const		4.95000	Const	0.100	Con
				±0.016		精密化	±0.07	→最	大 精密化	±0.03最小←	精密化
	✓	L2	* * Fe		92.783	Const		7.87400	Const	0.219	Con
				±0.03	→最大	精密化	±0.09	→最	大 精密化	±0.013	精密化
	✓	L1	Fe Fe		1.272	Const		3.93700	Const	0.314	Con
				±0.19		精密化	±0.09	最小←	精密化	±0.019	精密化
		基板	🖸 Si		00			2.32924	Const	0.500	Con